Под руководством Б.И. Селезнева совместно с группой А.С. Ионова разработан измеритель статических параметров микроприборов.



Измеритель статических параметров микроприборов

Измеритель предназначен для автоматизированного контроля статических параметров и измерения вольт-амперных характеристик транзисторных микро- и наногетероструктур на пластине и готовых приборов в корпусе. Он работает в составе измерительного комплекса совместно с персональным компьютером, автоматическим зондом и постом контроля. При работе совместно с автоматическим зондом контроля прибор позволяет разбраковывать транзисторные структуры на пластине в автоматическом режиме.